

# **Arbeitskreis Plasmaoberflächentechnologie**

## **Fachausschuß Normung**

*Bericht zur Herbstsitzung am 10.11.1999, Darmstadt*

### **DIN Normenausschuß Materialprüfung (NMP 161)**

- DIN-Vornorm DIN V 32939 „Mechanische Charakterisierung von Oberflächen mit laserinduzierten Ultraschall-Oberflächenwellen“ (Mai 1998) wird zukünftig im NMP 161 bearbeitet.
- Neues Normungsvorhaben im NMP 161 : „Schichtcharakterisierung mittels Thermowellen“

### **DIN Normenausschuß Feinmechanik und Optik; AA O3 Dünne Schichten für die Optik**

Ergebnisse der letzten Sitzung am 12./13. 10. 1999 in Aalen :

- DIN 58195 „Dünne Schichten für die Optik - Begriffe“ sind im August 1999 erschienen
- ISO-Normen 9211-1,2,3 „Optics and optical instruments“ werden ins deutsche Normenwerk übernommen. Eine baldige Überarbeitung wird angestrebt. Diese ISO-Normen werden z.Z. ins Deutsche übersetzt.

Interessenten wenden sich bitte an Dr. U. Beck (BAM VIII.2901, Tel.: 030/8104-1821 oder -1829, FAX: -1827, Email: uwe.beck@bam.de)

### **VDI-W Fachausschuß „Qualitätssicherung bei der (Vakuum-) Metallisierung von Kunststoffen“**

Der Ausschuß hat seine Arbeit mit intensiver Unterstützung der Industrie aufgenommen. Die letzte Sitzung des Fachausschusses fand am 13.10.99 in Dresden statt. Interessenten wenden sich bitte an Dr. M. Griepentrog (BAM VIII.2901, Tel.: 030/8104-3550 oder -1829, FAX: -1827, Email: michael.griepentrog@bam.de)

### **VDI-Richtlinie # 3824 „Qualitätssicherung bei PVD- und CVD-Hartstoffbeschichtungen“**

Aktuell verfügbar sind :

- Gründruck Blatt 1 (September 1999) „Eigenschaftsprofile und Anwendungsgebiete von Hartstoffbeschichtungen“
- Weißdruck Blatt 2 „Anforderungen an zu beschichtende Werkzeuge und Bauteile“
- Weißdruck Blatt 3 „Fertigungsabläufe und -tätigkeiten“ **deutsch/englisch**
- Gründruck Blatt 4 (September 1999) „Prüfplanung für Hartstoffschichten“

Weitere englische Versionen werden veröffentlicht, sobald die entsprechenden Weißdrucke vorliegen.

### **VDI/VDE-GMA-Fachausschuß FG 3.40 „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik“**

Konstituierende Sitzung am 29.7.1999.

Nächste Sitzung am 24.11.99 in Frankfurt beim VDE

Ziel: Erstellung von Richtlinien für den Bereich Mikro- und Nanomeßtechnik.

### **Internationale Normungsarbeit: Stand der Arbeiten in den ISO/TC's 201 und 202**

Die erste aus der Arbeit des TC201 resultierende Norm ist fertiggestellt (!) :

- ISO 14976 „Surface chemical analysis - Data transfer format“
- FDIS 14237 „Surface Chemical Analysis - Secondary ion mass spectrometry - Determination of boron content in silicon using uniformly doped materials “. Die Arbeiten an dieser Norm stehen kurz vor dem Abschluß.

Fünf weitere Normenprojekte liegen bereits als *Draft International Standard (DIS)* vor:

- ◆ DIS 15472 „Surface Chemical Analysis - X-Ray Photoelectron Spectrometers - Calibration of energy scales“
- ◆ DIS 14707 „Glow discharge optical emission spectrometry (GDOES) - Introduction to use“
- ◆ DIS 14706 „Surface chemical analysis - test method of surface elemental contamination on silicon wafers by total reflection X-Ray fluorescence spectroscopy“
- ◆ DIS 14606 „Surface chemical analysis - Sputter depth profiling - Optimization using layered systems as reference materials“
- ◆ DIS 14975 „Surface chemical analysis - Information formats“

Auf der letzten Sitzung des Beirats des Normenausschusses Materialprüfung im DIN (NMP) wurde beschlossen, daß die Bundesrepublik Deutschland weitere 2 Jahre ihren Beobachterstatus aufrecht erhalten soll. Dadurch können wir zumindest weiterhin aktuelle Informationen aus den **ISO/TC's 201 und 202 (Oberflächenanalytik)** über die HomePage der BAM im INTERNET zur Verfügung stellen.

# ***Arbeitskreis Plasmaoberflächentechnologie***

## ***Fachausschuß Normung***

*Bericht zur Herbstsitzung am 10.11.1999, Darmstadt*

Die Web-Adresse lautet: [http://www.bam.de/a\\_viii/forum/surface.html](http://www.bam.de/a_viii/forum/surface.html). Eine aktive Mitarbeit ist aber wegen fehlender finanzieller Unterstützung der Industrie weiterhin ausgeschlossen !

**Internationale Normungsarbeit: VAMAS** („Versailles Project on Advanced Materials and Standards“)

Erste Ergebnisse aus einem Ringversuch mit 40 Teilnehmern aus USA, Japan und EU zur „Evaluation of multilayer reference coatings for quantitative GDOES depth profiling“ werden zur Zeit ausgewertet. Über die Resultate wird vermutlich in 6 Monaten berichtet werden können. Interessenten wenden sich bitte an Dr. Uwe Beck, BAM VIII.201; Tel.: 030/8104-3560; FAX: -1827; Email: [uwe.beck@bam.de](mailto:uwe.beck@bam.de)

### **Diverses**

Ein Anwenderforum (mit Adressenliste) zur (spektroskopischen) Ellipsometrie ist auf der HomePage der BAM verfügbar sein: [http://www.bam.de/a\\_viii/forum/ellipsometrie.html](http://www.bam.de/a_viii/forum/ellipsometrie.html)

gez. G. Reiners

BAM Berlin, Tel.: 030/8104-1820; FAX: -1827  
Email: [georg.reiners@bam.de](mailto:georg.reiners@bam.de)